

# Vacuum test fixture VA 4060T/F/H/VPC-G12

Article 114678



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Interface de test sous vide avec cassette sous vide serrant en parallèle.
- Version robuste, facile à entretenir, d'une longévité hors pair
- Confort d'utilisation accru, manipulation simple et intuitive
- Bonne accessibilité au boîtier avec grand angle d'ouverture
- Cassette sous vide rétrofittable individuellement pour une mise en contact à 2 niveaux
- Pour le montage des articles livrés non montés, les dessins des articles indiqués dans la liste de pièces doivent être utilisés.

## Utilisation

Les interfaces de test sous vide (VA) sont utilisées pour mettre en contact, de façon sûre en processus, des cartes électroniques en grands nombres et comptant peu de variantes.

## Version

- Plaque porte-contacts en FR4 inviolable épais de 10 mm
- Plaque d'applique en FR3 épais de 6 mm avec surface conductrice ESD, y compris 4 vis de verrouillage imperdables
- Accès sans outil à la plaque porte-contacts, pour un remplacement facile des pointes de test usagées
- Boîtier à ouvrir avec outil (TORX T20).
- Poignées étriers rabattables pour un transport sûr et confortable

## Livraison

La livraison a lieu de façon partiellement montée. Le boîtier est livré monté, la cassette sous vide est livrée non montée, avec les composants à travailler spécifiques à l'objet à tester.

## Données générales

Interface pour système de test:

Groupe de produits:

Série principale:

Sous-série:

Série:

Taille du type:

Type d'interface de test:

Génération de course de contact:

Type de boîtier:

Sens de mise en contact:

Force de contact max.:

Course de contact parallèle env.:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

VPC-G12

Interface de test sous vide (VA)

VA xxxx

VA 40xx

VA 4060T

xx60T

Interface individuelle tandem

vide

Boîtier plat

à 1 niveau / à 2 niveaux

10.000 N

12,8 mm

16,1 kg

10 °C

60 °C

oui

## Caractéristiques techniques

Hauteur d'incorporation pointe de test en bas: 16 mm

Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas: 21,3 mm

Force of gas pressure springs: 400 N (200 N à gauche) / 200 N à droite)

Version standard: oui

Surface utile standard (LxP): 2 x 225 x 430 mm

Version ESD: non

Version haute fréquence: non

Version à aiguille rigide: non

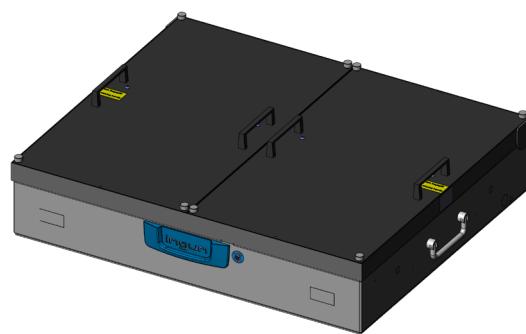
Version à 2 niveaux: oui, avec option supplémentaire adaptée

Surface utile à 2 niveaux (LxP): 2 x 205 x 430 mm

Mise en contact en haut (ZSK): oui, avec option supplémentaire adaptée

Dimensions hors tout fermé (LxPxH): 675 x 600 x 164 mm

NEW



## Remarque :

Pour équiper professionnellement l'interface de test sous vide VA 40xx, le schéma d'équipement INFO 4630 est utilisé pour les équipements à 1 niveau, et le schéma INFO 4638 est utilisé pour les équipements à 2 niveaux.

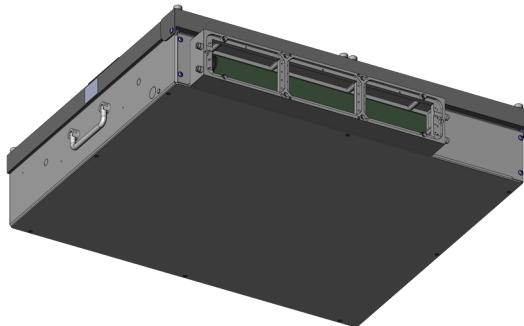
# Vacuum test fixture VA 4060T/F/H/VPC-G12

Article 114678

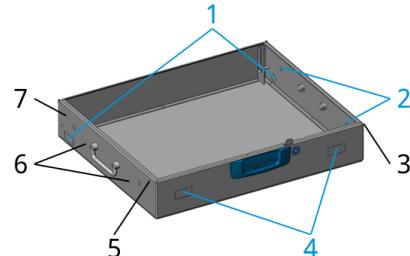


DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology



## Housing perforations and pilot holes



Perforated for:  
1. Cable connections  
2. Additional handles  
4. Stroke counter

Prepared for:  
3. ESD discharge button  
5. Anti-pinch protection  
6. Alum-A handles  
7. Earthing contact

## Accessories

Part no.	Designation	Version
115013	FB-2VE-VA4060T	Dual-stage shifting unit
114555	VD-V-VA4060T-2	Vacuum seal external
107048	VD-Z-21-300-200-2	Vacuum seal vacuum-free zone (fixed dimensions)
109501	VD-Z-21-XXX-XXX-2	Vacuum seal vacuum-free zone (variable dimensions)
8078	GDF-305-120-200N-A6-A6	Gas pressure spring
105791	FED-10,0-24,5-103N-11,6	Pressure spring
2599	HBS-03,0-10,0	Stroke-limiting disk
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter
113481	FB-TWA	Alum-A transport bracket
17036	FB-ALS-VAxxxx-2S	ESD discharge probe

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Kits d'interface de test

